

Письма в ЖТФ, том 18, вып. 11

12 июня 1992 г.

06.3; 07

© 1992

ФАЗОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ СИГНАЛА  
НЕСТАЦИОНАРНОЙ ФОТО-ЭДС  
В ФОТОРЕФРАКТИВНОМ КРИСТАЛЛЕ

О.П. Н е с т е р к и н, Е.П. Ш е р ш а к о в

Нестационарная фото-ЭДС возникает в кристаллах, имеющих ловушечные центры с концентрацией  $N_A$ , при освещении их нестационарной интерференционной картиной [1-4]. В самом деле, пусть кристалл освещен одновременно двумя интерференционными картинами: стационарной и движущейся с постоянной скоростью  $v = \Omega/q \gg (\tau_M q)^{-1}$ , где,  $q$  - пространственная частота решетки,  $\Omega$  - разность частот волн, дающих бегущую интерференционную картину,  $\tau_M$  - время релаксации решетки пространственного заряда.

Стационарная интерференционная картина записывает решетку поля пространственного заряда благодаря диффузии неоднородно возбужденных носителей и их дрейфу во внешнем постоянном поле. Комплексная амплитуда решетки поля  $E \sim E_{sc} e^{iqx} + \text{к. с.}$  имеет фазу, зависящую от величины внешнего поля  $E_0$ :

$$E_{sc} = -m_0 \frac{iE_D + E_0}{1 + E_D/E_q - iE_0/E_q}, \quad (1)$$

$m_0$  - контраст стационарной интерференционной картины,  $E_D = qkT/e$  - диффузионное поле,  $E_q = eN_A/\epsilon\epsilon_0 q$  - поле насыщения пространственного заряда,  $\epsilon$  и  $\epsilon_0$  - диэлектрические проницаемости кристалла и вакуума соответственно,  $e$  - заряд электрона.

Бегущая интерференционная картина не формирует решетку поля, т.к. для этого требуется относительно длительное время  $\tau_M$ :  $\Omega \gg \tau_M$ . Тем не менее, воздействие движущейся интерференционной

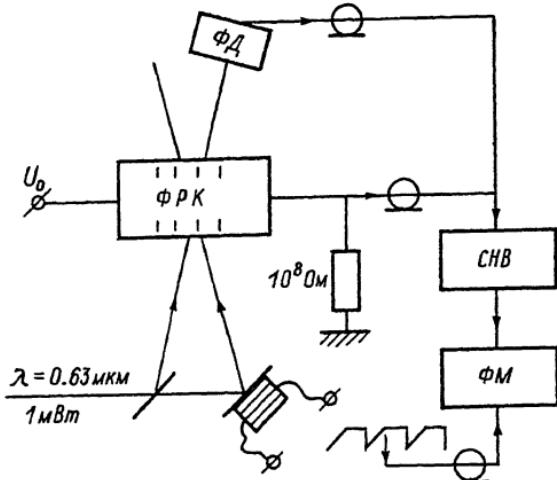


Рис. 1. Схема эксперимента. ФД - фотодетектор, СНВ - селективный нановольтметр, ФМ - измеритель разности фаз.

картины на кристалл проявляется в генерации решетки концентрации электронов проводимости  $n \sim n_1 e^{i(qx - \Omega t)}$  + к. с. с комплексной амплитудой [5]

$$n_1 = m_\Omega \frac{1 - i\Omega\tau_M}{1 + E_D/E_\Omega - iE_0/E_\Omega - \Omega\tau_M E_0/E_M - i\Omega\tau_M (1 + E_D/E_M)}, \quad (2)$$

описываемой при условии  $\Omega\tau_M \gg 1$  простым выражением

$$n_1 = m_\Omega \frac{1}{1 + E_D/E_M - iE_0/E_M}. \quad (3)$$

Здесь  $E_M = (\varphi_M \tau)^{-1}$  дрейфовое поле, определяемое произведением времени жизни электрона в зоне проводимости  $\tau$  на его подвижность  $\mu$ . Наличие двух решеток с амплитудами (1) и (3) приводит к появлению в кристалле однородного по пространству тока  $\langle nE \rangle \sim n_1 E_{sc} e^{-i\Omega t}$  + к.с., который осциллирует во времени. Здесь угловые скобки означают усреднение по пространству. Фаза временных осцилляций тока  $\Phi(E_0)$  складывается из фазы  $\psi(E_0)$  решетки поля (1), измеренной относительно статической интерференционной картины, и фазы  $\psi(E_0)$  решетки фотоэлектронов (3), измеренной относительно движущейся интерференционной картины. Зная зависимости  $\Phi(E_0)$  и  $\psi(E_0)$  и вычисляя по ним зависимость  $\psi(E_0)$ , можно определить важную характеристику кристалла  $\mu\tau$  при условии фиксированной пространственной частоты  $q$ . В предельном случае  $E_M = (\varphi_M \tau)^{-1} = 0$  фаза сигнала нестационарной фото-ЭДС полностью определяется решеткой поля (1).

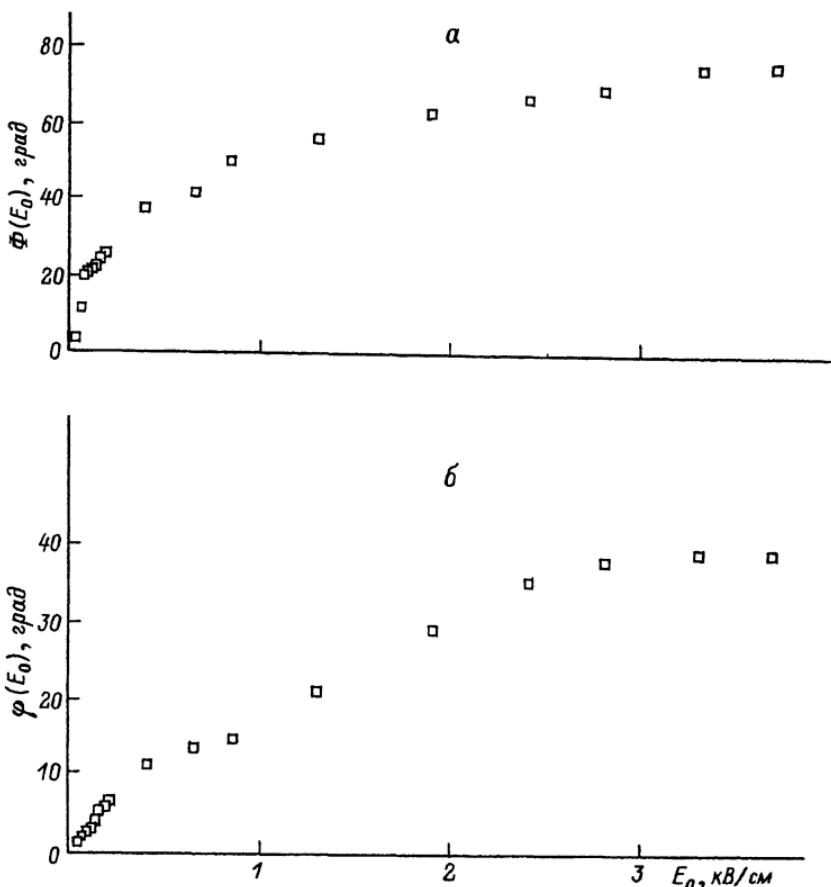
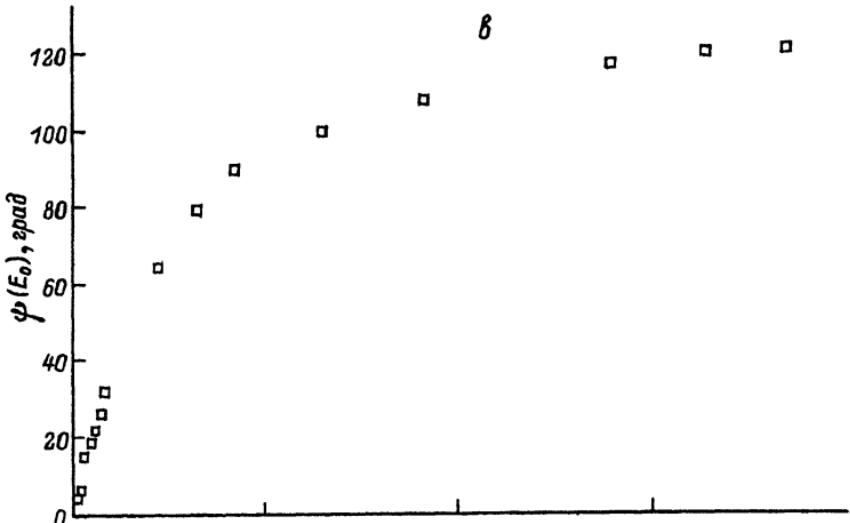


Рис. 2. Экспериментальные зависимости фазы  $\varphi_0(E_0)$  биений интенсивности и фазы нестационарной фото-ЭДС  $\Phi(E_0)$  от величины поля  $E_0$  для  $q = 3 \cdot 10^4 \text{ см}^{-1}$ : а, б - ВТО (малая дрейфовая длина,  $E_0/E_\mu > 1$ ), в, г - ВSO (большая дрейфовая длина,  $E_0/E_\mu \ll 1$ )

Для того чтобы осветить кристалл одновременно стационарной и движущейся интерференционной картиной, один из интерферирующих пучков должен состоять из смеси двух волн с частотами  $\omega$  и  $\omega + \Omega$ . Его интенсивность в этом случае имеет биения с частотой  $\Omega$ . Эти биения приводят к осцилляциям фототока, обусловленного внешним постоянным полем  $E_0$ . Чтобы избежать этого паразитного сигнала, в эксперименте один из пучков состоял из набора волн с частотами  $\omega$ ;  $\omega + \Omega$ ;  $\omega - \Omega$  и т.д. и имел постоянную во времени интенсивность. Практически это осуществлялось подачей на модулирующее пьезозеркало пилообразного сигнала с „тупым зубом“ (рис. 1) на частоте 25 Гц. Этот же сигнал служил репером при измерении фазы  $\Phi(E_0)$  сигнала нестационарной фото-ЭДС. Время записи решетки составляло 1–10 с.



2

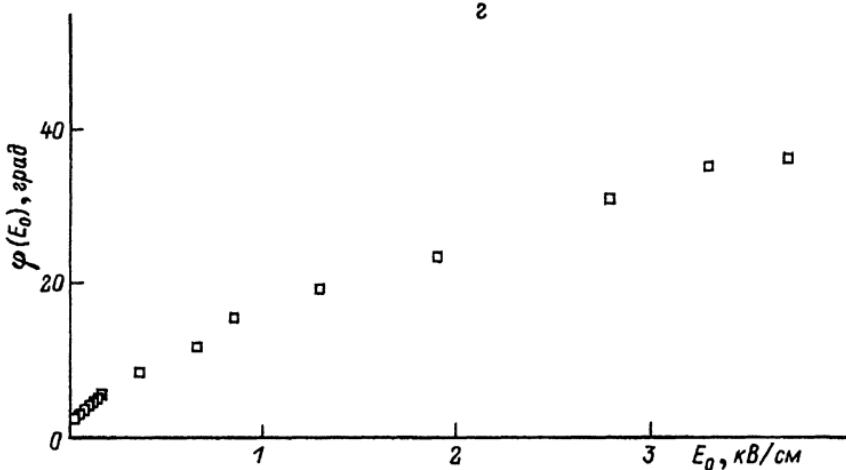


Рис. 2 (продолжение)

Фазово-промодулированная волна, дифрагируя на статической решетке и интерферируя с другой волной, дает осцилляции интенсивности, регистрируемые фотодетектором (см. рис. 1). Фаза этих осцилляций  $\varphi_D(E_0)$  аддитивным образом связана с фазой решетки поля  $\varphi(E_0) = \varphi_D(E_0) + C$ . Измерение зависимости  $\varphi_D(E_0)$  с точностью до несущественной константы определяет исковую зависимость  $\varphi(E_0)$ .

Измерения проводились в кристаллах ВТО и В О. Не-Не лазер мощностью 1 мВт использовался для получения двух когерентных волн (рис. 1), одна из которых модулировалась по фазе при помощи зеркала на пьезоподложке. Разность фаз измерялась при помощи фазометра Ф-27. Сигналы предварительно усиливались и фильтровались.

лись по частоте селективным нановольтметром. Экспериментальные зависимости представлены на рис. 2. Из приведенных данных видны следующие особенности. Фазы сигнала биений интенсивности совпадают для двух исследованных образцов, в которых моделировались различные предельные случаи соотношения  $E_o/E_M$ . ВТО соответствует малой дрейфовой длине ( $E_o/E_M \ll 1$ ), BSO - большой дрейфовой длине ( $E_o/E_M > 1$ ). По-видимому, это объясняется независимостью фазы стационарной решетки поля от соотношения  $E_o/E_M$ . Вместе с тем фаза сигнала нестационарной фото-ЭДС при больших полях ( $E_o > 1$  кВ/см) зависит от соотношения  $E_o/E_M$  в исследуемом образце. Сравнение параметра  $E_o/E_M$  с единицей проводилось на основании наличия ( $E_o/E_M > 1$ ) или отсутствия ( $E_o/E_M \ll 1$ ) вырожденного двухвольнового взаимодействия во внешнем переменном поле [6]. К сожалению, наличие частотной компоненты  $\omega - \Omega$ , дающей противоположно движущуюся интерференционную картину, не допускает простую трактовку, изложенную в начале данного сообщения. Для определения параметров кристалла  $N_A$  и  $M^2$  требуется анализ экспериментальных данных, учитывающий удельный вес компонент  $\omega + \Omega$  и  $\omega - \Omega$  в промодулированной волне, а также их относительную разность фаз.

Таким образом, в данной работе экспериментально продемонстрирована зависимость фазы сигнала нестационарной фото-ЭДС от величины внешнего постоянного приложенного поля, если одна из волн, дающих интерференционную картину, промодулирована по фазе так, что в промодулированной волне вклады компонент с противоположными сдвигами частот неэквивалентны.

#### Список литературы

- [1] Трофимов Г.С., Степанов С.И. // ФТТ. 1986. Т. 28. № 9. С. 2785.
- [2] Петров М.П., Степанов С.И., Трофимов Г.С. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 12. № 15. С. 916.
- [3] Петров М.П., Степанов С.И., Трофимов Г.С. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. № 15. С. 265.
- [4] Соколов И.А., Трофимов Г.С., Степанов С.И. // ЖТФ. 1988. Т. 58. № 2. С. 429.
- [5] Nestiorkin O.P. // Opt. Comm. 1991. V. 81. N 5. P. 315.
- [6] Stepanov S.I., Petrov M.P. // Opt. Comm. 1985. V. 53. N 5. P. 292.

Поступило в Редакцию  
12 апреля 1992 г.